

XPS分析(X線光電子分光)でできること

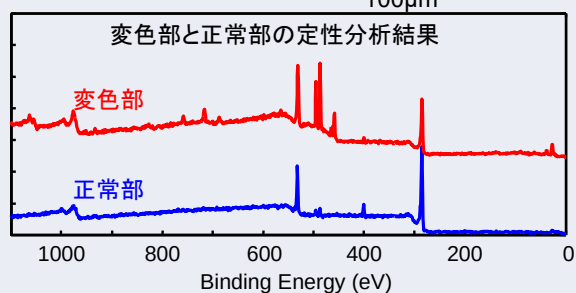
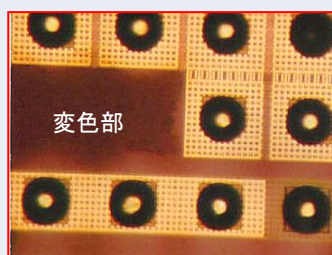
XPS分析では、X線を試料に照射し、発生する電子のエネルギーを分析することで、表面の厚さ数nmの元素の種類と量および化学結合状態を調べます。金属、半導体、ガラス、セラミック、有機物、高分子材料などの分析ができ、接合、濡れ性、耐蝕、腐食、変色、汚染、洗浄、付着、吸着、表面処理などの問題解決に威力を発揮します。

特徴

絶縁性の試料でも分析できます

元素の種類だけでなく化学的結合状態を調べ、マッピングすることも可能です

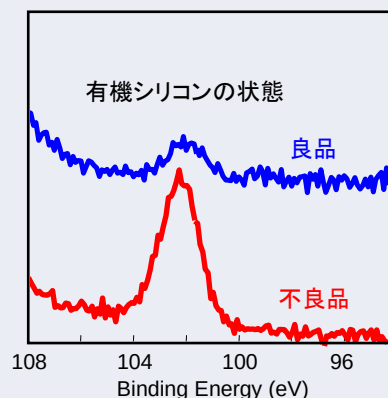
分析事例1 ポリイミド表面の変色



変色部にアンダーパンプメタル成分が付着

分析事例2 はんだ濡れ不良

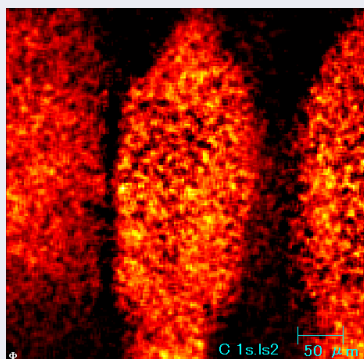
けい素の状態分析結果



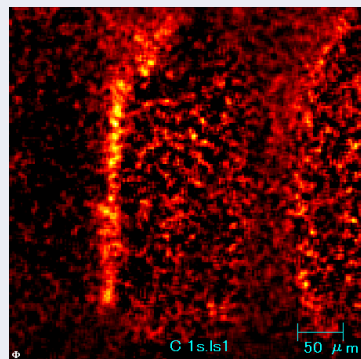
不良品表面にはシリコンオイルが多量に付着

分析事例3 電極付着物のマッピング分析(化学結合状態のマッピング)

※エポキシの状態の炭素をマッピングできます



炭素の分布



エポキシの状態の炭素の分布

お問い合わせ先

ユーロフィンFQL株式会社 信頼性評価、環境試験、故障解析、品質保証サポート

<https://www.eurofins.co.jp/efql/contact>

9時～17時 土・日・祝日・当社指定の休業日を除く